

# OCI-V 光矢量分析系统



## 产品特点 >>

- 自校准
- 测量长度：200m
- 波段：C+L、O波段（可选）
- 1秒内测量多种光学参数

## 产品应用 >>

- 平面波导器件
- 硅光器件
- 光纤器件
- 波长可调器件、放大器、滤波器

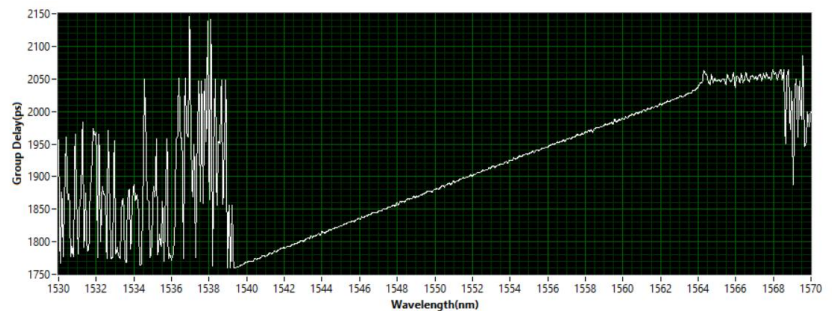
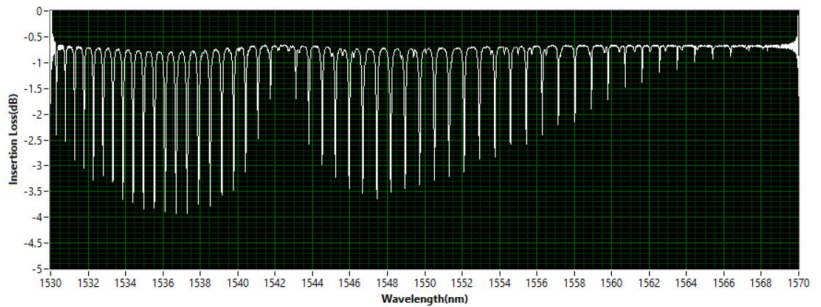
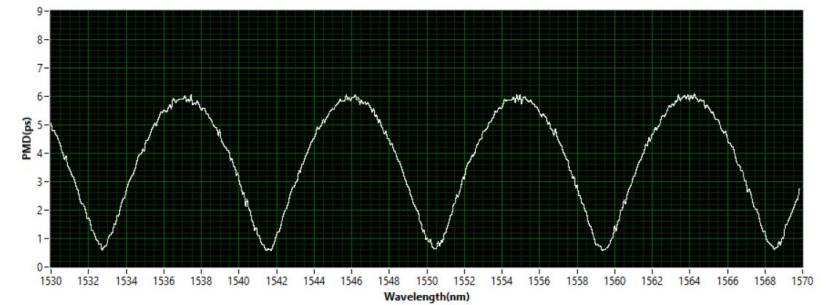
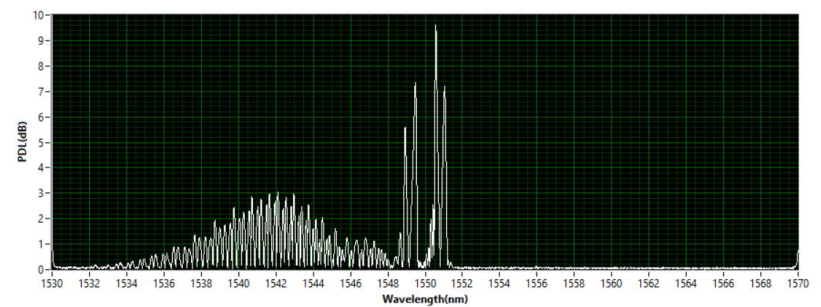
## 测量参数 >>

- 偏振相关损耗PDL
- 偏振模色散PMD
- 插损IL
- 群延时GD
- 色散CD
- 琼斯矩阵参数
- 光学相位



## 产品描述 >>

OCI-V是一款快速检测光学器件损耗、色散和偏振等相关参数的光矢量分析系统。其原理是采用线性扫频光源对待测器件进行扫描，并结合相干检测技术获取待测器件的琼斯矩阵，进而获得器件插损、色散、偏振相关损耗、偏振模色散等光学参数。该系统采用独特光路设计以及先进算法，实现智能校准，操作简单，极大节省测试时间。



备注：测试样品分别是倾斜光栅、硅光芯片、HCN 吸收室、啁啾光栅。

## 产品参数 &gt;&gt;

主要参数			
	标准模式	高动态范围模式	
测量长度 <sup>1</sup>		200	m
波段	C+L 波段: 1525~1625; O 波段: 1265~1340		nm
波长分辨率		1.6	pm
波长精度		±1.0	pm
<b>损耗 (IL)</b>			
动态范围	60	80 <sup>1</sup>	dB
插损精度	±0.1	±0.05	dB
分辨率	±0.05	±0.002	dB
回损精度		±0.1	dB
<b>群延时 (GD)</b>			
量程		6	ns
精度	±0.2	±0.1	ps
损耗范围	45	60	dB
<b>色散 (CD)</b>			
精度	±10	±5	ps/nm
<b>偏振相关损耗 (PDL)</b>			
动态范围	40	50	dB
精度	±0.05	±0.03	dB
<b>偏振模色散 (PMD)</b>			
量程		6	ns
精度		±0.1	ps
损耗范围	40	50	dB
<b>硬件</b>			
主机功率		60	W
通讯接口		USB	-
光纤接口		FC/APC	-
尺寸	W 450 * D 450 * H 166		mm
重量		18.5	kg
储藏温度		0 ~ 50	°C
工作温度		10 ~ 40	°C
<b>定制功能<sup>2</sup></b>			
测量长度	50	100	m
空间分辨率	10	20	μm
回损测量范围	-125 ~ 0		dB
插损动态范围		18	dB
插、回损分辨率		0.05	dB
插、回损精度		±0.1	dB

## 备注:

1. 透射模式测量长度200m, 可拓展反射模式, 测量长度为100m;
2. 光矢量分析仪(OCI-V)可拓展OFDR功能, 测量光纤链路;
3. 产品参数均可以根据用户需求进行定制。

## 武汉昊衡科技有限公司

电话: 027-87002165 邮箱: sales@mega-sense.com 网址: www.mega-sense.com  
地址: 湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号武汉未来科技城B4栋14楼(430206)

产品技术规格如有变更, 恕不另行通知, 如有疑问, 请与我司联系。

